

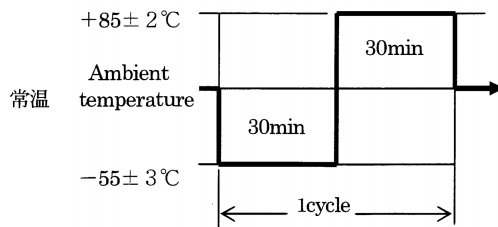
製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION		No,	IS-6206K	来歴/REV.	/
		頁	1/3		
標 題 : 6206 シリーズ 3.7 mm ピッチコネクタ SUBJECT : SERIES 6206 3.7 mm pitch connector		制定年月日 ISSUE DATE	'05-9-30		
		改訂年月日 REVISED DATA	'13-1-25		
1. 適用範囲 本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 6206 シリーズ 3.7 mm ピッチ コネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。		1.Scope This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 6206 3.7 mm pitch connector.			
2. 形状、寸法及び材質 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する。) 標準たわみ：実装面より 2.0mm の高さ。 使用圧縮範囲：実装面より 1.6～2.0 mm の高さ 適用品番：IMSA-6206S-02B-***-1		2.Configurations dimensions and materials See the product drawing attached. (Applied to Pb free plate product) Standard flexing height : 2.0mm from component side. Use compression range : height 1.6～2.0 mm from component side. Applied to : IMSA-6206S-02B-***-1			
3. 定格 (1)最大定格電圧 : 125 V(AC,DC) (2)最大定格電流 : 1.0A (3)使用温度範囲 : -40～+105℃		3.Rating (1)Maximum rating voltage : 125V (AC,DC) (2)Maximum rating current : 1.0A (3)Temperature range : -40～+105℃			
4. 試験環境 特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。 常温 : 15～35℃ 常湿 : 25～85% R H		4.Environmental condition All performance tests, unless otherwise specified, are taken under following environmental condition. Ambient temperature : 15～35℃ Ambient humidity : 25～85%RH			
5. 特性 5-1.電気的特性		5.Performance 5-1.Electrical performances			
No.	項目/Items	条件/Test conditions		規格/specifications	
1	接触抵抗 Contact resistance	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル抵抗計にて測定する。 It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.		初期値 : 20mΩ以下 各試験後 : 40mΩ以下 Initial : 20mΩ or below After each test: 40mΩ or below	
2	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	隣接する極間に AC 250V を 1 分間印加する。 AC 250 V shall be applied for one minute to between next terminals.		絶縁破壊等異常のない事。 Should not have any changes.	
3	絶縁抵抗 Insulation resistance	隣接する極間に DC 250V を印加し、測定する。 It shall be measured when 250V DC is applied to between next terminals.		初期値 : 1000MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more 各試験後 : 100MΩ以上 After each test : 100MΩ or more	
4	外観 Appearance	目視 Visual		有害となる割れ、剥がれ、ガタ 変形、変色等のない事。 Should not have any flaw, scratch, discoloration and crushed .	
5-2.機械的特性		5-2.Functional performance			
No.	項目/Items	条件/Test conditions		規格/specifications	
1	コンタクトの保持力 Contact retention force	コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトがハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the contact begins to remove from the housing.		0.98N 以上 0.98N or more.	
2	接触力 Contact force	接触部を 5mm/分の速度で荷重を加え、実装面より 2.0mm の高さまで変位させた時の荷重を測定する。 The contact shall be pushed at the speed of 5mm per min, and the force shall be measured when the height 2.0mm from component side.		初期値にて/Initial 0.69N 以上 0.69N or more	
3	脱着耐久性 Insertion/extraction endurance	実装面より 1.6mm の高さ迄 30 回脱着を行った後、標準たわみ状態にて接触抵抗を測定する。 The connector and printed circuit board shall be mated and unmated 30 times and measured the contact resistance after the test, when the standard flexing.		40mΩ以下 40mΩ or below	

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
4	振動試験 Vibration test	標準たわみ状態にて接触させ、振幅 1.5 mm、振動周波数 10～55～10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な 3 方向に各々 2 時間 計 6 時間 の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。 The contact move of standard flexing is vibrated in the frequency range of 10～55～10Hz per minute and in the constant vibration amplitude 1.5mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中 1 μ s 以上の瞬断のない事。 試験後：40m Ω 以下 有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形等ない事。 Discontinuity:1 μ s or below After the test:40m Ω or below Should not have any flaw, scratch, and crushed
5	衝撃試験 Shock test	標準たわみ状態にて接触させ、治具に取付け、加速度 490m/s ² 、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。 The contact moved of standard flexing is installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); under the conditions as specified; acceleration of 490m/s ² and shock pulses for a duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中 1 μ s 以上の瞬断のない事。 試験後：40m Ω 以下 有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形等ない事。 Discontinuity:1 μ s or below After the test:40m Ω or below Should not have any flaw, scratch, and crushed

5.3.環境特性

5.3.Environmental performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性 Heat resistance	標準たわみ状態にて接触させ、温度 105 \pm 2 $^{\circ}$ C の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The contact moved of standard flexing is exposed in the heat chamber 105 \pm 2 $^{\circ}$ C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40m Ω 以下 40m Ω or below
2	耐湿性 Humidity	標準たわみ状態にて接触させ、温度 40 \pm 2 $^{\circ}$ C、相対湿度 90～95%RH の雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The contact moved of standard flexing is exposed in the humidity chamber 40 \pm 2 $^{\circ}$ C, 90～95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40m Ω 以下 40m Ω or below
3	SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test	標準たわみ状態にて接触させ、温度 40 \pm 2 $^{\circ}$ C、相対湿度 75%RH、濃度 10 \pm 1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO ₂ gas chamber 40 \pm 2 $^{\circ}$ C, 75%RH 10 \pm 1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40m Ω 以下 40m Ω or below
4	H ₂ S ガス試験 H ₂ S gas test	標準たわみ状態にて接触させ、温度 40 \pm 2 $^{\circ}$ C、相対湿度 75%RH、濃度 3 \pm 1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the H ₂ S gas chamber 40 \pm 2 $^{\circ}$ C, 75%RH 3 \pm 1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40m Ω 以下 40m Ω or below
5	塩水噴霧試験 Salt spray test	標準たわみ状態にて接触させ、槽内温度 35 \pm 2 $^{\circ}$ C、濃度 5 \pm 1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The contact moved of standard flexing is exposed in the salt spray chamber 35 \pm 2 $^{\circ}$ C, 5 \pm 1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40m Ω 以下 40m Ω or below
6	冷熱衝撃試験 Thermal shock test	標準たわみ状態にて接触させ、下図の温度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The contact moved of standard flexing is exposed 10 cycles in the following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test.	40m Ω 以下 40m Ω or below



No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	温湿度サイクル試験 Humidity Resistance (cycling)	<p>標準たわみ状態にて接触させ、下図の温湿度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The contact moved of standard flexing is exposed 10 cycles under the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test.</p>	40mΩ以下 40mΩ or below

5-4.その他の特性

5-4.Other performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性 Solderability	<p>コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃のSn-Ag-Cu系の鉛フリー槽に3±0.5秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃, 3±0.5s.</p>	<p>浸した面積の95%以上に半田がむらなく付着する事。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.</p>
2	半田耐熱性 Resistance to soldering heat	<p>下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 The resistance to soldering heat is tested under the following conditions.</p> <p>(1)リフローの場合/In case of reflow リフロー回数/Reflow cycles: 2回/times</p> <p>(予熱 130~190℃) (pre-heat 130~190℃)</p> <p>温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of a product.</p> <p>(2)手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鋲温度 / temperature : 350±5℃ 時間 / time : 3±0.5s</p>	<p>端子のガタ、割れ等異常のない事。 Should not have any flaw, scratch and crack.</p>
3	温度上昇試験 Rise of temperature test	<p>最大許容電流を通電し、熱伝対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 The connector shall be operated in the maximum rise of current and measured rise of the temperature at contact point.</p>	<p>温度上昇: 30℃以下 Rise of temperature: 30℃ or below</p>

6.注意事項

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカが発生する可能性があります。その為、ウィスカ発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

6.Attention

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.